

Test system for fault detection and diagnosis in microprocessor control devices

Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, Tõnu; Männisalu, Mati; Pukk, P.; Vanamölder, E. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 63-77: ill

Язык УТОПИСТ

Männisalu, Mati; **Tõugu, Enn**; Unt, M.; Fuksman, Adolf Алгоритмы и организация решения экономических задач : сборник статей 1977 / с. 80-113 https://www.ester.ee/record=b2080193*est